

# バイポーラトランジスタの拡散層構造評価

pn判定を含む拡散層の構造を明瞭に観察可能

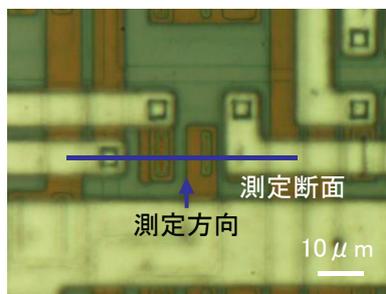
測定法 : SCM  
製品分野 : LSI・メモリ  
分析目的 : 形状評価・製品調査

## 概要

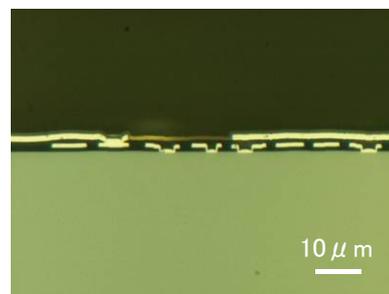
市販LSI内のNPNバイポーラトランジスタについて全景からエミッタ部の拡大まで詳細に観察が可能です。エミッタ電極の中心を通る断面を露出させ、AFM観察、SCM測定を行った事例です。AFM像と重ねることで、配線との位置関係がはっきりします。

## データ

### ■測定箇所

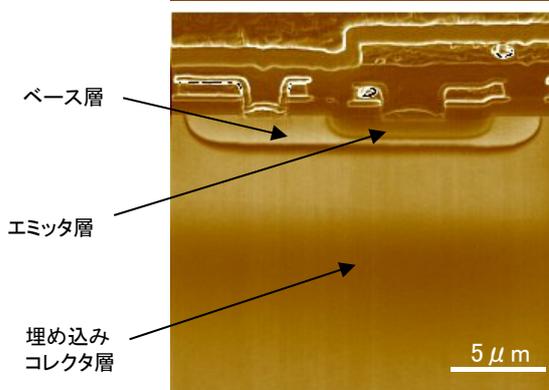
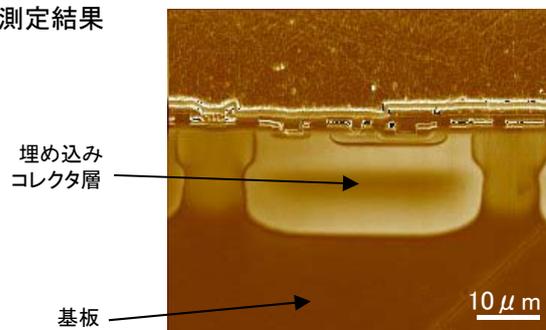


表面写真

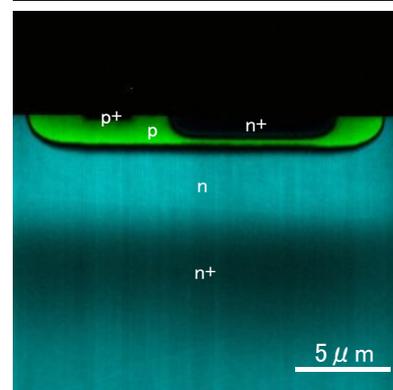
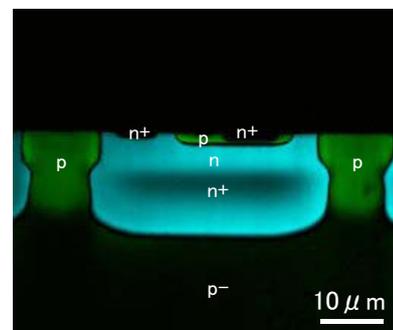


測定断面写真

### ■測定結果



AFM 像 + SCM 像 (強度像)



SCM 像 (極性像)

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人  
**MIST** 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp  
URL : <http://www.mst.or.jp/>